Hedman / Pianetta

X-Ray Absorption Fine Structure -- XAFS13

13th International Conference

The scope of this Conference was X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) and related techniques and topics using synchrotron radiation. Many techniques and theories focusing on XAFS-related phenomena are presented. These techniques are used in many scientific areas to study electronic and real space structure of a multitude of materials.



285,10 €
266,45 € (zzgl. MwSt.)

Nicht mehr lieferbar

Artikelnummer: 9780735403840
Medium: Buch
ISBN: 978-0-7354-0384-0
Verlag: AIP Press
Erscheinungstermin: 23.03.2007
Sprache(n): Englisch
Auflage: 1. Auflage 2007
Serie: AIP Conference Proceedings
Produktform: Gebunden
Seiten: 937
Format (B x H): 216 x 279 mm

Kundenservice Verlag Dr. Otto Schmidt KG
Neumannstraße 10, 40235 Düsseldorf | kundenservice@otto-schmidt.de | 0221-93738-997 (Inland)